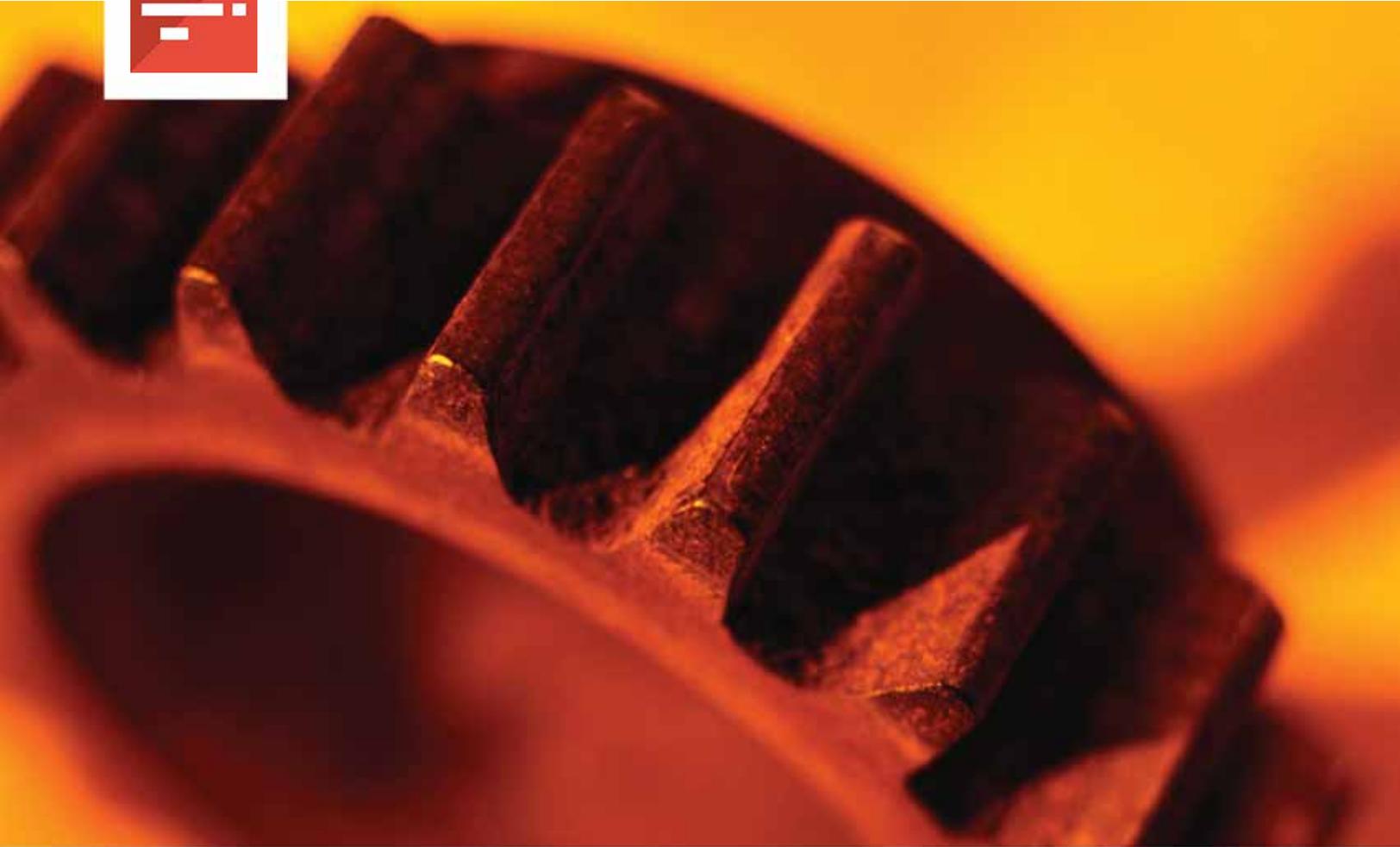


La solution fiable pour analyser la teneur en inclusions



CLEMEX CIR

Inclusions non métalliques dans l'acier

Rapidité, précision, intelligence

Clemex CIR peut analyser une zone de 160 mm² en moins de 2 minutes. Affichez des résultats précis et reproductibles, classés par coulée et par échantillon.

Analysez plusieurs échantillons

Le système peut analyser jusqu'à 24 échantillons non montés provenant de différentes coulées, en moins d'une heure.



Des solutions adaptées à vos besoins

Un logiciel facile à apprendre

Avec son interface conviviale, notre système automatisé de cotation d'inclusion est de la technologie de pointe facile à utiliser. La mise en service est effectuée par un expert.

Porte-échantillon sur mesure

Choisissez parmi notre gamme de porte-échantillons en option, pour les échantillons montés ou non montés. Nous pouvons également concevoir un porte-échantillon spécialement pour vos besoins.

La non-uniformité des échantillons

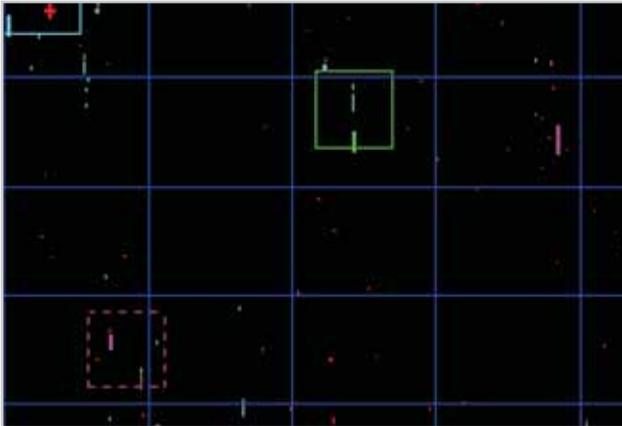
Les échantillons montés ont souvent des tailles variées et ne sont pas toujours montés au même endroit dans la résine. Nous avons ajouté une fonction pratique de repérage de bordure qui vous sauve du temps en réglages.

Normes internationales

Se conformant aux normes EN 10247, ISO 4967, ASTM E45 (A, C, D, E), DIN 50602 (M, K), et JIS G 0555, Clemex CIR est assez souple pour s'adapter à différentes normes.

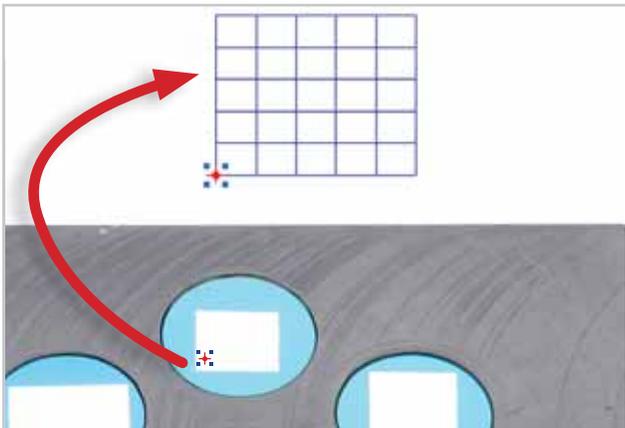
La solution rapide et fiable pour analyser la teneur en inclusions

Les laboratoires et les aciéries choisissent Clemex CIR pour répondre aux spécifications des entreprises et des industries dans l'évaluation des inclusions. Cette solution permet aux laboratoires d'améliorer considérablement leur productivité en automatisant leurs analyses d'inclusions avec une rapidité, une précision et une répétabilité surprenante. Clemex CIR analyse des échantillons de toutes les tailles. La zone de 160 mm² (ASTM E45) prend moins de 2 minutes et celle de 200 mm² (ISO 4967) prend moins de 3 minutes.



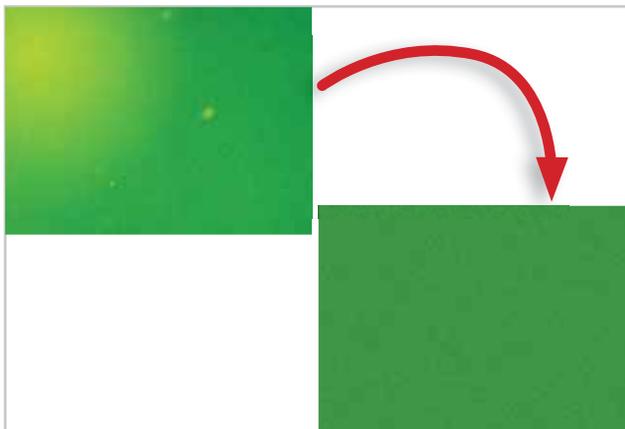
Mappage multichamps de l'entièreté de l'échantillon

Localise et mappe les inclusions de la zone d'échantillonnage, alignés verticalement ou horizontalement. Les pires champs sont identifiés rapidement et les artefacts peuvent être enlevés facilement. Les rectangles bleus représentent les champs du microscope, tandis que les carrés de couleur représentent les pires champs. colored squares are worst field frames.



Détection automatisée des rebords des échantillons

Clemex CIR trouve le bord physique de chaque échantillon automatiquement ce qui lui permet de créer des quadrillages qui couvrent toute la surface. Pour les échantillons montés, lorsque l'échantillon d'acier n'est pas exactement de la même taille ou dans la même position chaque fois.



Fonction unique de correction d'ombrage

Assure un éclairage uniforme pour toutes les images, assurant une classification précise des inclusions et des artefacts. L'image de gauche a été prise sans correcteur d'ombrage. Un LUT en pseudo-couleur a été appliqué pour démontrer les différentes variations en niveau de gris.

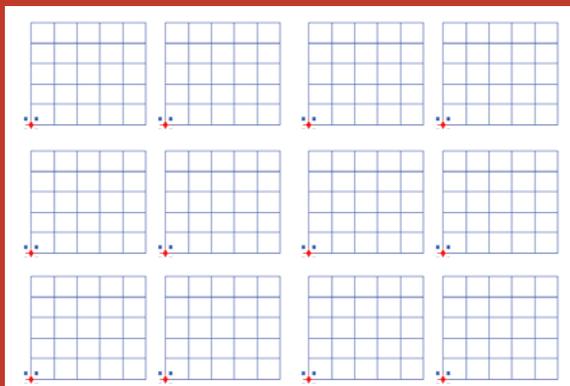
L'évaluation des inclusions en 3 étapes faciles

L'interface conviviale de Clemex CIR permet aux opérateurs de maîtriser les fonctions du logiciel avec un minimum de formation. Après un réglage de base facile à comprendre, le système est prêt à analyser jusqu'à 24 échantillons avec peu d'intervention de l'opérateur. Une fois l'analyse terminée, les résultats peuvent être consultés et validés en utilisant la carte des inclusions de Clemex CIR.



Étape 1

Installez le porte-échantillon



Étape 2

Cliquez Démarrez



Étape 3

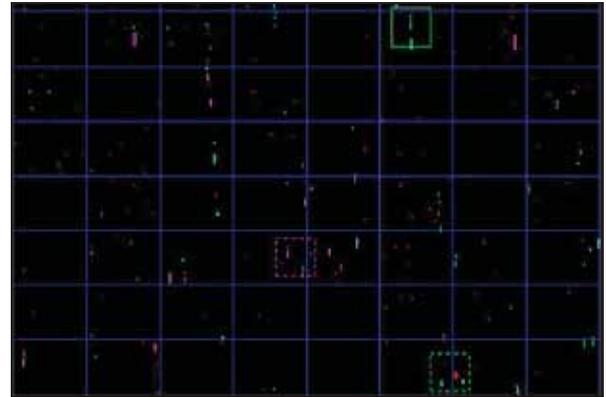
Obtenez des résultats

Caractéristiques du produit



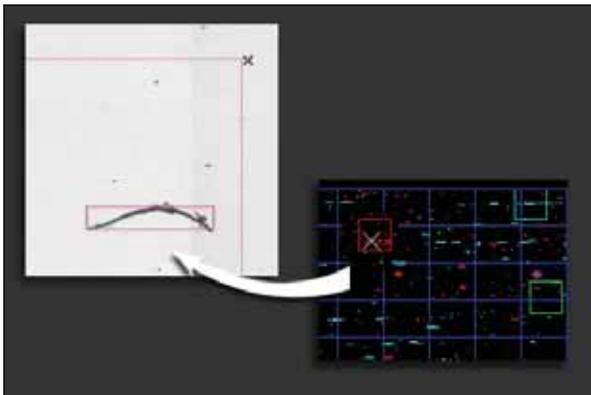
Différents types d'inclusions

Les évaluations sont basées sur les normes internationales. Classez différents types d'inclusions: Sulfures (A), Alumines (B), Silicates (C), Globulaires (D), Globulaires simples (DS), Borures, Carbures, Nitrures (X₂CN).



Mappage intelligent de l'échantillon

La fonction de mappage stocke les coordonnées de chaque objet analysé dans un environnement multichamps. Les utilisateurs peuvent naviguer entre les différents échantillons et valider les inclusions, qu'il y en ait peu ou des centaines.



Inclusions facilement traçables

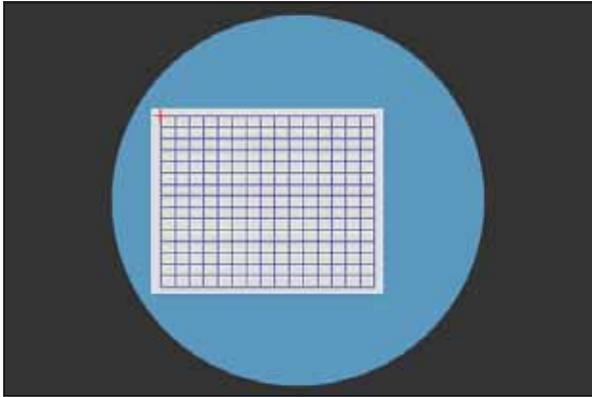
Une fois l'analyse terminée, les positions de toutes les inclusions sont mémorisées par le logiciel. D'un simple clique sur la mappe multichamps Clemex CIR déplace la platine et le porte-échantillons au champ sélectionné et affiche toutes les inclusions qui s'y trouvent.



Évaluation des pires champs

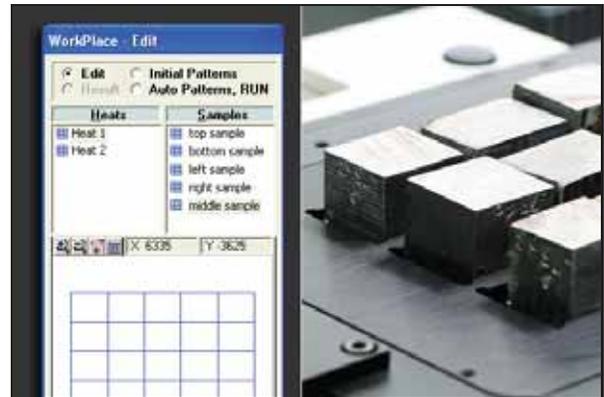
Les pires champs sous les normes ASTM, ISO ou DIN sont identifiés automatiquement: autant les grosses inclusions (lignes pleines) que les inclusions minces (lignes pointillées). Les pires champs sont affichés en utilisant des couleurs spécifiques aux types d'inclusions.

Caractéristiques du produit



Création des quadrillages

Clemex CIR trouve le bords des échantillons et crée automatiquement un quadrillage d'analyse pour couvrir une surface soit de 160 mm carrés, de 200 mm carrés, ou de la grandeur totale de votre échantillon.



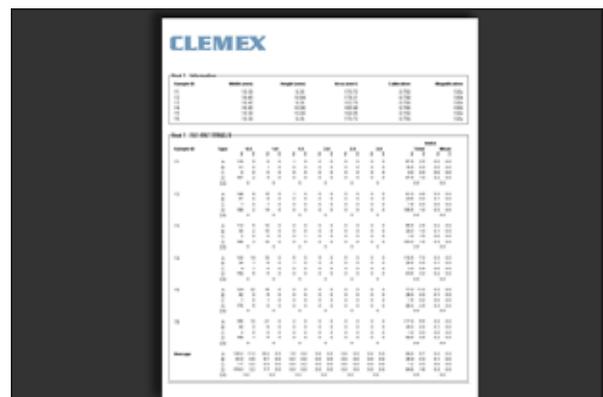
Analyse de coulées différentes

Les échantillons peuvent être traités un à la fois ou regroupés par coulées/échantillons, jusqu'à 6 coulées de 6 échantillons par analyse.



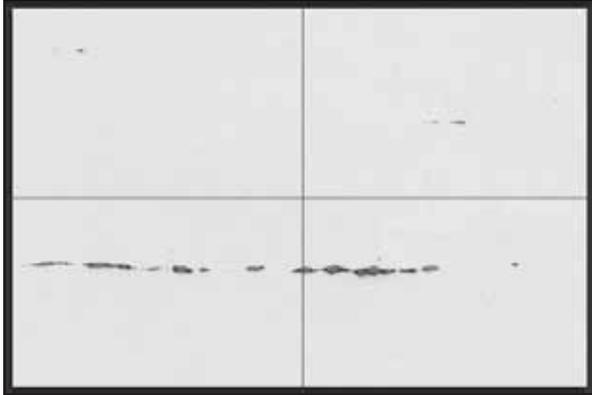
Échantillons montés et non montés

Les laboratoires à haut débit, tels que dans les aciéries, préfèrent analyser les échantillons non montés afin de sauver du temps de préparation. Clemex CIR analyse les échantillons montés ou non.



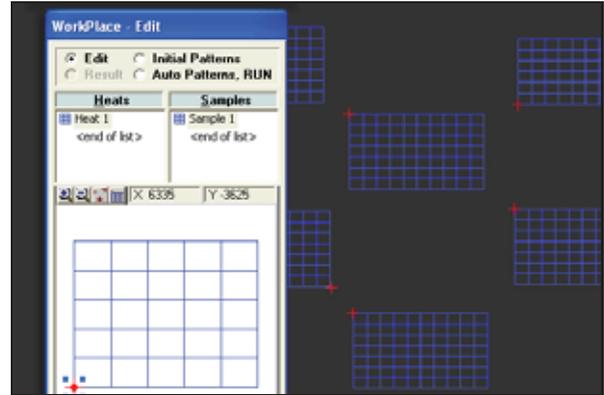
Des rapports professionnels

Les rapports sont générés automatiquement selon les normes définies. Les données accumulées durant l'analyse peuvent être exportées en format tableau TXT ou en fichiers Microsoft Excel.



Inclusions traversant des champs

Toutes les inclusions traversant plus d'un champ sont prises en considération lors de l'analyse, peu importe leur taille ou leur position par rapport aux bords des champs de vision du microscope.



Quadrillages définis par l'utilisateur

Avec son interface conviviale, Clemex CIR vous permet de créer des quadrillages d'analyse en quelques secondes.

Rapports Connexes



Taux d'inclusion dans l'acier



Cotation inclusionnaire dans l'acier selon la norme ASTM E45



Cotation inclusionnaire dans l'acier selon la norme DIN 50602

Notre engagement: l'excellence en imagerie

Nous sommes les experts en applications d'analyses d'images microscopiques simples et complexes pour:

Les matières premières

Les poudres

Les pièces métalliques

Les contaminants

Les applications personnalisées

CLEMEX

www.clemex.com

Contact:

Clemex Technologies inc.
800 Guimond, Longueuil, QC, J4G 1T5, Canada
Telephone: 1.888.651.6573
info@clemex.com - www.clemex.com
© Copyright Clemex Technologies Inc. 06-2015